



KCS 2026 전시업체 기업소개서

	대 표 자	지용래
	홈페이지	www.jwc.co.kr
	이 메 일	jwcsupport@jwc.co.kr
	전화번호	031-8065-6700
	주 소	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워A동 1405호
	주요물품	박막 Stress 측정 장치 (k-Space)
회사소개		
* Thin Film Stress / Strain / Curvature 측정장치(MOS System) 1) 대면적 Curvature & stress 및 mapping 이 가능한 MOS Ultra scan, 2) 기판에 최고 1,000℃까지 온도를 높이면서 온도변화에 따른 stress 를 측정할 수 있는 MOS Thermal Scan 특징 - 1x1 cm 조각 시편부터 12인치 웨이퍼 및 Glass 측정 가능 - Full Mapping 데이터 관리 가능 (2D, 3D) Application - Semiconductor / Oxide Semi / Compound Semi - 2D Material / Quantum Computing - Hybrid Bonding - Cu plating / HBM - RDL, Inter Connect - EUV Pellicle - Power Semiconductor - Glass substrate		